

DIN 50451-5:2010-03 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Elementspuren in Flüssigkeiten - Teil 5: Leitlinie zur Auswahl von Werkstoffen und Prüfung ihrer Eignung für Geräte zur Probenahme und Probenvorbereitung für die Elementspuren-Bestimmung im Bereich von Mikrogramm je Kilogramm und Nanogramm je Kilogramm

Inhalt	Seite
Vorwort	5
Einleitung	6
1 Anwendungsbereich	7
2 Normative Verweisungen	7
3 Begriffe	7
4 Werkstoffeinfluss der Geräte und Hilfsmittel auf die Proben	7
4.1 Allgemeines	7
4.2 Kunststoffe	8
4.3 Kieselglas	8
5 Kriterien für die Auswahl geeigneter Gerätewerkstoffe	8
6 Eignungsprüfung	11
6.1 Reagenzien	11
6.2 Reinigung der Probenahme- und Probenvorbereitungsgefäße	11
6.3 Durchführung	11
6.4 Angabe der Ergebnisse	12
6.5 Prüfbericht	12
Literaturhinweise	13
Tabellen	
Tabelle 1 — Beständigkeit von Gerätewerkstoffen gegenüber unterschiedlichen Klassen chemischer Substanzen	10